(Item 1 from file: 351) DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv. 011699577 \*\*Image available\*\* WPI Acc No: 1998-116487/ 199811 Related WPI Acc No: 2002-210356 XRPX Acc No: N98-093399 Test support apparatus used in software development - has list sequence generation part that outputs test specification described by selected Patent Assignee: MITSUBISHI ELECTRIC CORP (MITQ Number of Countries: 001 Number of Patents: 002 Patent Family: Patent No Applicat No Kind Date Kind Date Week JP 10003405 19980106 JP 96154231 Α А 19960614 199811 B2 20011002 JP 96154231 JP 3214356 19960614 200164 Priority Applications (No Type Date): JP 96154231 A 19960614 Patent Details: Patent No Kind Lan Pq Main IPC Filing Notes JP 10003405 A 14 G06F-011/28 JP 3214356 В2 17 G06F-011/28 Previous Publ. patent JP 10003405 Abstract (Basic): JP 10003405 A The test support apparatus has internal state transition table (103) with which the test specification, frequency of passage, transition state, transition time of cells are recorded. A transition table display part (104) displays information of particular cell which is received from table. The interpretation of operation of the selected cell which is displayed is done by the operator. The frequency of passage of particular selected cell is then updated. The test specification described by selected cell is given as output by a test sequence generation part (105). ADVANTAGE - Offers error free test sequence of test item. Enables efficient reproduction of test sequence accompanied modification of specification. Dwg.1/21 Title Terms: TEST; SUPPORT; APPARATUS; SOFTWARE; DEVELOP; LIST; SEQUENCE; GENERATE; PART; OUTPUT; TEST; SPECIFICATION; DESCRIBE; SELECT; CELL Derwent Class: T01 International Patent Class (Main): G06F-011/28 International Patent Class (Additional): G06F-009/06 File Segment: EPI 3/5/2 (Item 1 from file: 347) DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv. 05720305 \*\*Image available\*\* TEST SUPPORT DEVICE PUB. NO.: 10-003405 A] PUBLISHED: January 06, 1998 (19980106) INVENTOR(s): NAKAJIMA TAKESHI APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan) APPL. NO.: 08-154231 [JP 96154231] FILED: June 14, 1996 (19960614) INTL CLASS: [6] G06F-011/28; G06F-009/06 JAPIO CLASS: 45.1 (INFORMATION PROCESSING -- Arithmetic Sequence Units)

#### ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To smoothly input a test sequence preparing job

without mistake by providing an internal state transition table where the test specifications including the next transition state and the operations to be carried out in a transition mode are recorded.

SOLUTION: A state transition table input part 102 inputs a state transition table 101 and outputs an internal state transition table 103 where the test specifications including the next transition state and the operations to be carried out in a transition mode and the passing frequency of a relevant cell are recorded in plural cells respectively. A transition table display part 104 inputs the table 103 and displays it in the form of a table. A test sequence generation part 105 interprets an operation where a cell is selected out of the displayed table 103 by an operator, updates the passing frequency of the selected cell and also successively generates the test specifications described on the selected cell. Thus, a test sequence can be produced with no leakage nor errors of test items in order to display the candidate cells of the present state and to successively guide the operator to the input operations.

#### (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

### (11)特許出願公開番号

## 特開平10-3405

(43)公開日 平成10年(1998)1月6日

(51) Int.Cl. 6	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
G06F 11/2	28 340		G06F	11/28	3 4 0 A	
. 9/	06 540			9/06	540U	

#### 審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 14 頁)

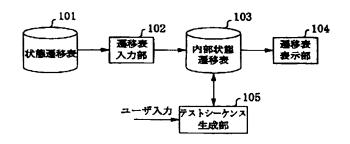
		20 - 12 (M) 41 (	Nemac management of the control
(21)出願番号	<b>特顯平8-154231</b>	(71)出顧人	000006013
			三菱電機株式会社
(22)出顧日	平成8年(1996)6月14日	東京都千代田区丸の内二丁目2番3号	
		(72)発明者	中島の設
			東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三
			菱電機株式会社内
		(74)代理人	弁理士 宮田 金雄 (外3名)
		ı	

#### (54) 【発明の名称】 テスト支援装置

#### (57) 【要約】

【課題】 ソフトウェア開発において、対象システムのテストを行なうためのテストシーケンスを作成する作業を、誤りなくスムーズに入力することを可能とすることを課題としている。

【解決手段】 複数のセルに、次に遷移する状態及び遷移時に実行される動作を含むテスト仕様と当該セルの通過回数とが記録される内部状態遷移表103と、この内部状態遷移表103を入力し表示する遷移表表示部104と、この表示された内部状態遷移表中のセルが操作者により選択される操作を解釈し、この選択されたセルの通過回数を更新するとともに、選択されたセルに記述されている前記テスト仕様を出力するテストシーケンス生成部105とを備えたものである。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のセルに、次に遷移する状態及び遷移時に実行される動作を含むテスト仕様と当該セルの通過回数とが記録される内部状態遷移表と、

この内部状態圏移表を入力し表示する圏移表表示部と、この表示された内部状態圏移表中のセルが操作者により 選択される操作を解釈し、この選択されたセルの通過回 数を更新するとともに、選択されたセルに記述されてい る前記テスト仕様を出力するテストシーケンス生成部と を備えたことを特徴とするテスト支援装置。

【請求項2】 システムにより予め定義された前記テスト仕様が記述されているテストシーケンスファイルと、このテストシーケンスファイルに記述された前記テスト仕様と前記テストシーケンス生成部により出力された前記テスト仕様とを比較するテストシーケンストレース部とを備えたことを特徴とする請求項1記載のテスト支援装置。

【請求項3】 システムにより予め定義された前記テスト仕様が記述されているテストシーケンスファイルと、このテストシーケンスファイル中の前記テスト仕様に該 20 当する項目が前記テストシーケンス生成部により更新された前記内部状態遷移表中に存在するか否かをマークするマーキング部と、

このマーキング部によりマークされた前記内部状態遷移 表を解析し、テスト項目の重複を判定する重複判定部と を備えたことを特徴とする請求項1記載のテスト支援装 置。

【請求項4】 システムにより予め定義された前記テスト仕様が記述されているテストシーケンスファイルと、このテストシーケンスファイル中の前記テスト仕様に該当する項目が前記テストシーケンス生成部により更新された前記内部状態遷移表中に存在するか否かをマークするマーキング部と、

このマーキング部によりマークされた前記内部状態遷移 表を解析し、テスト項目の不足を判定する不足判定部と を備えたことを特徴とする請求項1記載のテスト支援装 置。

【請求項5】 次に遷移する状態とこの状態遷移を引き起こすイベントとが含まれる状態遷移表と、

この状態遷移表中に含まれる前記状態と前記イベントとを抽出するイベント状態抽出部と、

この抽出された状態とイベントとに基づいて、イベント の内容を定義したイベント状態定義表を生成するイベン ト状態定義生成部とを備えたことを特徴とするテスト支 援装置。

【請求項6】 状態遷移を引き起こすイベントの内容が システムにより予め定義されたイベント状態定義ファイ ルと、

前記イベント状態抽出部により抽出されたイベントが前 記イベント状態定義ファイル中に存在するか否かをチエ ックするイベント状態照合部とを備えたことを特徴とする請求項5記載のテスト支援装置。

2

【請求項7】 前記イベント状態照合部のチエックにより、前記イベント状態抽出部により抽出されたイベントが前記イベント状態定義ファイル中に存在しなかった場合に、前記抽出されたイベントの内容を前記イベント状態定義ファイルに追加するイベント状態定義追加部を備えたことを特徴とする請求項6記載のテスト支援装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### 10 [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、状態ベースの仕様からテストシーケンスを生成する支援や、状態ベースの仕様テスト自動実行システムへの入力データとなるイベント定義を生成する支援を行なうテスト支援装置に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】ソフトウェア、ハードウェア、あるいは 両者が混在するシステム開発において、開発対象である システムの仕様を早期に誤りなく決定するために、有限 状態機械など状態ベースの仕様記述を用いて、開発対象 システムがどのように動作するかの仕様を分析/定義す ることが広く行なわれている。図21は、例えば特開昭 63-148747号公報に示される従来の状態遷移仕 様に基づくテスト支援装置である。状態・イベント検索 部2002では、入力された状態遷移図2001から状 態およびその直後のイベントを取り出す。次に同時操作 抽出部2003では、取り出された個々の状態及びイベ ントに対して、同時操作抽出ルール2005を検索して 同時操作となり得るイベントの組み合わせを調べ、それ に従ってその状態において起こり得る同時操作とその結 果の状態とを求める。このようにして状態遷移図200 1中のすべての状態およびイベントに対して上記の処理 を行ない求めた結果を、試験項目表作成部2004によ って同時操作試験の試験項目表2006にして出力す

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】図21に示す従来のテスト支援装置は、状態遷移図に含まれる全状態と、そこから出ていく状態遷移を対象に、同時操作試験ルールに したがって対象となる状態遷移を選択し、選択された状態遷移から、遷移を引き起こすイベントと遷移後の状態のリストを表の形式にして出すものである。従来の状態遷移仕様に基づくテスト支援装置からは、テスト項目として、各状態に対する発生イベントとそれに対する期待値である遷移先が出力される。このような従来のテスト支援装置には、次のような問題点があった。

(1)状態遷移図を基となる仕様としているので、状態に対して遷移を引き起こすイベントだけが記述されており、状態とイベントとの組み合わせが網羅的にならな50 い。

(2) 出力されたテスト項目をすべてテストするためには、まず各状態にシステムの状態を設定してから、状態 遷移を引き起こすイベントを入力しなければならない。この設定は非常に面倒であるので、テストを実施する前に、複数の状態遷移を順次たどるためのテストシーケンスを改めて生成しなければならない。

【0004】テスト自動実行装置とは、テストシーケンスとその中で使われているイベントと状態を定義するイベント・状態表を入力し、そのテストシーケンスを実施し結果をレポートする装置である。イベント・定義とは、テストシーケンス中で使われているイベントを表とという場合がある数値になったといかの関連で来たなど)を定義したためいての作業に時間がかかるとともに、テストシーケンスで使っていながらイベント・状態定義表は、テストシーケンスで使っていながらイベント・状態定義といという場合が起こり、テスト自動実行ができないという問題点があった。

【0005】この発明は上記のような問題点を解決するためになされたもので、ソフトウェア開発において、対象システムのテストを行なうためのテストシーケンスを作成する作業を、誤りなくスムーズに入力することを可能とし、仕様の変更に対して、テストシーケンスの変更作業を効率良くすることを目的としている。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】第1の発明は、複数のセルに、次に遷移する状態及び遷移時に実行される動作を含むテスト仕様と当該セルの通過回数とが記録される内部状態遷移表と、この内部状態遷移表を入力し表示する遷移表表示部と、この表示された内部状態遷移表中のセルが操作者により選択される操作を解釈し、この選択されたセルの通過回数を更新するとともに、選択されたセルに記述されている前記テスト仕様を出力するテストシーケンス生成部とを備えたものである。

【0007】第2の発明は、システムにより予め定義された前記テスト仕様が記述されているテストシーケンスファイルと、このテストシーケンスファイルに記述された前記テスト仕様と前記テストシーケンス生成部により出力された前記テスト仕様とを比較するテストシーケンストレース部とを備えたものである。

【0008】第3の発明は、システムにより予め定義された前記テスト仕様が記述されているテストシーケンスファイルと、このテストシーケンスファイル中の前記テスト仕様に該当する項目が前記テストシーケンス生成部により更新された前記内部状態遷移表中に存在するか否かをマークするマーキング部と、このマーキング部によりマークされた前記内部状態遷移表を解析し、テスト項目の重複を判定する重複判定部とを備えたものである。

【0009】第4の発明は、システムにより予め定義さ 50

4

れた前記テスト仕様が記述されているテストシーケンスファイルと、このテストシーケンスファイル中の前記テスト仕様に該当する項目が前記テストシーケンス生成部により更新された前記内部状態遷移表中に存在するか否かをマークするマーキング部と、このマーキング部によりマークされた前記内部状態遷移表を解析し、テスト項目の不足を判定する不足判定部とを備えたものである。【0010】第5の発明は、次に遷移する状態とこの状態遷移を引き起こすイベントとが含まれる状態遷移表とこの状態遷移表中に含まれる前記状態と前記イベントとを抽出するイベント状態抽出部と、この抽出された状態とイベント状態連出で、イベントの内容を定義したイベント状態定義表を生成するイベント状態定義生成

【0011】第6の発明は、状態遷移を引き起こすイベントの内容がシステムにより予め定義されたイベント状態定義ファイルと、前記イベント状態抽出部により抽出されたイベントが前記イベント状態定義ファイル中に存在するか否かをチェックするイベント状態照合部とを備20 えたものである。

【0012】第7の発明は、前記イベント状態照合部の チェックにより、前記イベント状態抽出部により抽出さ れたイベントが前記イベント状態定義ファイル中に存在 しなかった場合に、前記抽出されたイベントの内容を前 記イベント状態定義ファイルに追加するイベント状態定 義追加部を備えたものである。

#### [0013]

#### 【発明の実施の形態】

部とを備えたものである。

実施の形態 1. 図 1 は、本発明の実施の形態 1 によるテ スト支援装置の機能構成図を示す。図1において、10 1は、本テスト支援装置の入力となる状態遷移表、10 2は、状態遷移表101を入力し、内部状態遷移表10 3を出力する状態遷移表入力部である。104は、内部 状態遷移表103を入力し表の形式で表示する遷移表表 示部である。105は、ユーザが状態遷移表101中の セルを選択する操作を解釈し、選択されたセルに相当す るテスト項目を順次生成するテストシーケンス生成部で ある。図2は、状態遷移表101の一例である。状態遷 移表101は、行としてシステムの状態、列としてシス テムへの入力学ペントをとるマトリックスデータである (行と列が逆の場合もある)。1つの状態と1つのイベ ントで指定されるセルには、次に遷移する状態と遷移の 瞬間に実行されるアクションを記述する。図2におい て、次のような構文ルールとなっている。

#### 遷移先状態/アクション

選移先状態に「一」を指定している箇所は、選移がなく アクションのみを実行するという意味である。斜めに線 を引かれたセルは、起こり得ない遷移を表している。こ のセルを除いた残りのセルを有効セルと呼ぶ。内部状態 選移表103は、入力の状態遷移表101に加えて、表 全体に現在の状態と次入力イベントの候補を示すデータ 領域と、各セルに通過回数のデータ領域とを加えたもの である。ある現在状態で通過回数が 0 である有効セルを 候補セルと呼ぶこととする。

【0014】図3は、実施の形態1の動作を示すフロー チャートであり、このフローチャートに基づいて実施の 形態1の動作を説明する。まず、遷移表入力部102が 状態遷移表101を読み込み(301)、内部状態遷移 表103へ出力する。この際、すべてのセルの有効回数 を0に設定する。遷移表表示部104が内部状態遷移表 103を表示する(302)。以下、ユーザによる終了 指定が行なわれるか、すべての有効セルの通過回数が1 以上になるまで、テストシーケンス生成部105が、テ ストシーケンス作成処理(303)を繰り返す。テスト シーケンス作成処理(303)では、まずユーザからの 初期状態の入力を待つ(304)。この際、候補セルの ない初期状態が選ばれないようにする。候補セルのある 初期状態を入力できた場合、入力結果を現在状態に代入 する。そうでない場合には終了する。この入力した初期 状態を次のように出力する(305)。

#### 初期状態

次に、現在状態に初期状態を代入し(306)、現在状態に対する候補セルがなくなるまでテスト項目処理(307)では、その候補セルをハイライトし(308)、セルの選択待ち(309)に入る。ユーザが候補セルの中から1つ選択すると、そのセルの記述に基づいて次の出力をする(310)。

(入力イベント, 遷移先状態, アクション) 次に現在状態の値を遷移先状態とし(311)、選択されたセルの通過回数を1増やし(312)、テスト項目処理(307)に戻りこの処理を繰り返す。

【0015】図4は、実施の形態1の動作の流れを説明 する説明図である。図4の左側には遷移表表示部104 によって表示される内部状態遷移表103の画面イメー ジを示す。図4の左側に示される内部状態遷移表103 の各セルの値は、状態遷移表101からコピーされたも のである。図4の右側には、その左の画面に対応した内 部状態遷移表103の内部データを示す。その内部デー タとしては、現在状態と候補セルと通過回数と、その時 点でのテストシーケンス出力がある。例えば、出力=s 1-> (e 1, s 2, a 1) -> (e 1, s 2, -)は、「初期状態slからスタートし、入力イベントel が来ると期待値として、次の状態がs2になりアクショ ンとしてa1を出力する。次に入力イベントe1が来る と期待値として、次の状態が s 2 で変わらず何もアクシ ョンが出力されない」という意味である。また、通過回 数= (1, 0, 1, 0)は、セル11 (1行1列のセル の意味:状態s1-イベントe1に対応)の通過回数= 1、セル12の通過回数=0、セル21の通過回数=

6

1、セル22の通過回数=0という意味である。

【0016】図4において、201は初期画面であり、 初期状態としてS1が指定され、候補セルとしてセル1 1がハイライト表示されている。202は、初期画面に 対してユーザがセル11を選択した後の結果を示す画面 である。画面202で、セル11がマークされ、現在状 態をセル11に示された遷移先状態であるs2とし、s 2に対する候補セルであるセル21とセル22をハイラ イト表示している。画面203は、画面202からさら に、ユーザがセル21を選択したときの結果を表す画面 である。画面203では、現在状態は変わらず、セル2 1がマークされ、候補セルがセル22だけになる。画面 204は、画面203からさらに、ユーザがセル22を 選択したときの結果を表す画面である。現在状態s1に 対して候補セルが存在しないので、このテストシーケン スはここまでで終了である。さらに候補セルのある状態 がないので、処理を終了する。

【0017】以上のように本実施の形態によれば、状態 遷移表に基づくテストシーケンス作成において、一つの 20 テスト項目の次遷移先状態と、その次のテスト項目の現 在状態とは一致していなければならないが、現在状態に 対する候補セルを見せ操作者を順次入力導いていくた め、誤りなくテストシーケンスを作ることができる。ま た、既に生成したテストシーケンスで通過した候補セル は、ハイライトされないので重複したテスト項目を選択 してしまうことを防ぐ。さらにまた、既にテスト項目と して選択したセルを表示するため、何がテスト項目とし て残っているかを把握することができ、テスト項目をも れなく作りながら効率的にテストシーケンスを作ること ができる。これらによって、従来例の問題点であるテス ト項目の網羅性が保証されないことと、テスト項目生成 とテストシーケンスの生成が別の作業となることを解決 している。

【0018】なお、本実施の形態においては、図2に示した状態遷移表を用いたが、階層的な状態を用いた状態 遷移表においても、ある現在状態に対して上位の状態まで含めて候補セルを作成するようにすれば、本実施の形態と同様に扱うことができる。また、本実施の形態の動作の説明では、図4に示したようにハイライト表示やマイクの表示を行うが、操作者にそれとわかる他の方法を用いることも勿論可能である。

【0019】実施の形態2.図5は、本発明の実施の形態2によるテスト支援装置の機能構成図を示す。図5において、101~104は図1に示す機能プロックと同様のものである。403は、次の形式の内容をテストシーケンス1単位として記述する複数のテストシーケンスを含むテストシーケンスファイルである。\*は繰り返しを表す。

テストシーケンス=初期状態+テスト項目\* 50 テスト項目=(入力イベント, 遷移先状態, アクショ ン)

401は、エラー判定付テストシーケンストレース部であり、テストシーケンスファイル403を読み込み、個々のテストシーケンスを内部状態遷移表103上でトレースすることで、システムの仕様とテストシーケンスとの間の食い違いを報告する。

【0020】次に実施の形態2の動作について説明す る。図6は、遷移表入力部102によって内部状態遷移 表103がすでに初期設定されている段階での、エラー 判定付テストシーケンス部401の動作を示すフローチ ャートである。図6において、まずエラー判定付きテス トシーケンストレース部401がテストシーケンスファ イル403の読み込み(601)を行ない、テストシー ケンスがある限り、個々のテストシーケンスにユニーク な番号としてシーケンス番号をふり、テストシーケンス 処理(602)を繰り返す。テストシーケンス処理(6 02)では、対象テストシーケンスの初期状態が、内部 状態遷移表103にあるかどうかをチェックし(60 3) 、内部状態遷移表103上にない場合には、エラー リポート1 (607) において、次のメッセージを出力 *20* し、新たなテストシーケンスを対象としてテストシーケ ンス処理(602)を行なう。

シーケンス番号:状態名:初期状態が存在しない 内部状態遷移表103上にある場合には、内部状態遷移 表103内の現在状態を読み込んだ初期状態として(6 04)、テスト項目がある限り、テスト項目処理(60 5)を行なう。ここで処理対象となるテスト項目を対象 テスト項目と呼ぶ。

【0021】次に、現在状態の候補セル中に、対象テスト項目の入力イベントが存在するかどうかをチェックする(606)。入力イベントが候補セル中にない場合には、エラーリポート2(612)において、次のメッセージを出力し、新たなテストシーケンスを対象としてテストシーケンス処理(602)を行なう。

シーケンス番号:現在状態名:入力イベント名:入力イベントが存在しない

入力イベントが候補セル中にある場合には、その候補セルを選択セルとし、対象テスト項目にあるアクションと、選択セル内のアクションとを比較する(608)。アクションが異なる場合、エラーリポート3(613)において、次のメッセージを出力し、(609)の処理を実行する。

シーケンス番号:現在状態名:入力イベント名:アクション名:アクションが異なる

アクションが同じ場合には、何もせずに(609)の処理を実行する。(609)では、対象テスト項目の遷移 先状態を選択セル内の遷移先とを比較する。遷移先が異なる場合には、エラーレポート4(614)において、 次のメッセージを出力し、新たなテストシーケンスを対象としてテストシーケンス処理(602)を行なう。 8

シーケンス番号:現在状態名:入力イベント名:遷移先 状態名:遷移先が異なる

選移先が同じ場合には、現在状態をその選移先状態にして (610)、次のテスト項目を対象テスト項目として テスト項目処理 (605)を行なう。

【0022】以上のように本実施の形態によれば、状態 遷移表に基づくテストシーケンス作成において、テストシーケンスファイル内に記述されたテストシーケンス群 と、仕様である内部状態遷移表とを比較し、その差異をレポートすることができるので、作成者がマニュアルで作成したテストシーケンスの誤りを検出することができる。 さらに、仕様自体への変更に対し、既に存在するテストシーケンスが新しい仕様に適合しているかどうかをチェックすることができるので、仕様の変更にともなうテストシーケンスの再作成を効率良く行なうことができる。

【0023】なお、本実施の形態は、エラーメッセージを一定の形式のテキストとして出力するものであるが、同じ情報を異なる形式で操作者に見せることも可能である。例えば、図5に示す遷移表表示部104が表示している状態遷移表の上でエラー位置を見せることも可能である。

【0024】実施の形態3. 図7は、本発明の実施の形 態3によるテスト支援装置の機能構成図を示す。図7に おいて、101、102、104は図1に示す機能プロ ックと同様のものである。1703は内部状態遷移表で あり、実施の形態1で示した内部状態遷移表103に次 の変更を加えたものである。内部状態遷移表103では 各セルにマークをつける際、通過回数のみを保存してい 30 たが、通過したテストシーケンス群の番号を記録する番 号リストのデータ領域を持つものとした。1701は、 テストシーケンスファイル403を入力し、テストシー ケンスをトレースしつつ、トレース結果を内部状態遷移 表1703にマークしていくマーキング付テストシーケ ンストレース部である。1702は、マーキング付テス トシーケンストレース部1701によりトレース結果が 反映された内部状態遷移表1703を解析して、テスト 項目の重複を判定する重複判定部である。

【0025】次に実施の形態3の動作について説明す 40 る。図8は、マーキング付テストシーケンストレース部 1701の動作を示すフローチャートであり、図7で示した遷移表入力部102によって内部状態遷移表170 3がすでに初期設定されていることが仮定されている。図8は、図6に示したエラー判定付テストシーケンストレース部401のフローチャートから、エラーレポート1(607)、エラーレポート2(612)、アクションがあるか(608)、エラーレポート3(613)、エラーレポート4(614)等の各処理を削除し、(2201)のセルをマークする処理を加えたものである。 50 (2201)では、対象セルの番号リストに、通過した

テストシーケンスのシーケンス番号の付加を行なう。 【0026】図9は、重複判定部1702の動作を示す フローチャートである。重複判定部1702は、マーキ ング付テストシーケンストレース部1701の処理が終 了した状態で、処理が行なわれる。図9で、内部状態遷 移表1703内のすべてのセルを対象セルとして重複判 定処理(2401)を行なう。重複判定処理(240 1) では、対象セルの番号リストが、2つ以上の番号を 持っている場合(2402)、次のエラーメッセージを 出力する(2403)。

セル番号:シーケンス番号リスト:テスト項目に重複あ

【0027】以上のように本実施の形態によれば、状態 遷移表に基づくテストシーケンス作成において、テスト シーケンスファイル内に記述されたテストシーケンス群 と、仕様である内部状態遷移表とを比較し、テストシー ケンスの重複度をレポートすることができるので、作成 者がテキストエディタ等を使ってマニュアルで作成した テストシーケンスの冗長な部分を見つけることができ る。

【0028】なお、本実施の形態は、エラーメッセージ を一定の形式のテキストとして出力するものであるが、 同じ情報を異なる形式で操作者に見せることも可能であ る。例えば、表示している状態遷移表の上でエラー位置 を見せることも可能である。

【0029】実施の形態4. 図10は、本発明の実施の 形態3によるテスト支援装置の機能構成図を示す。図1 0において、101、102、104、1701、17 03は図7に示す機能ブロックと同様のものである。1 802は、マーキング付テストシーケンストレース部1 701がトレース結果を反映した内部状態遷移表170 3を解析して、テスト項目の不足を判定する不足判定部 である。

【0030】次に実施の形態4の動作について説明す る。図11は、不足判定部1802の動作を示すフロー チャートである。不足判定部1802は、マーキング付 テストシーケンストレース部1701の処理が終了した 状態で、処理が行なわれる。図11で、内部状態遷移表 1703内のすべてのセルを対象セルとして不足判定処 理 (2501) を行なう。不足判定処理 (2501) で は、対象セルの番号リストの要素が0個である場合(2 502)、次のエラーメッセージを出力する(240 3)。

セル番号:テスト項目に不足あり

【0031】以上のように本実施の形態によれば、状態 遷移表に基づくテストシーケンス作成において、テスト シーケンスファイル内に記述されたテストシーケンス群 と、仕様である内部状態遷移表とを比較し、テストシー ケンスが不足する分をレポートすることができるので、 作成者がマニュアルで作成したテストシーケンスの不足 50 例1)イベント「初期化」は、プログラム内のラベルM

10 する部分を見つけることができる。また、実施の形態1

と組み合わせて、不足した分を作業者に示しながらテス トシーケンスを補充する支援を行なうこともできる。

【0032】なお、本実施の形態は、エラーメッセージ を一定の形式のテキストとして出力するものであるが、 同じ情報を異なる形式で操作者に見せることも可能であ る。例えば、表示している状態遷移表の上でエラー位置 を見せることも可能である。

【0033】実施の形態5. 図12は、実施の形態2~ 10 4について、仕様である内部状態遷移表と、検査対象で あるテストシーケンスの間で、どのようなチェックが行 なわれるかを示す図である。図12で、検査対象はテス トシーケンス1 (504) とテストシーケンス2 (50 5) であり、仕様は内部状態遷移表506である。実施 の形態2では、テストシーケンス1(504)の3番目 のテスト項目 (e 2, s 1, a 4) のアクション a 4 が、内部状態遷移表506上のアクションa3と異なる ので、次のエラーメッセージが出力される(501)。 1:e2:s1:a4:アクションが異なる

20 実施の形態 3 では、テストシーケンス1 (5 0 4) とテ ストシーケンス2 (505) が、セル22で重なってい るので、次のエラーメッセージが表示される(50 3).

22:1, 2:テスト項目に重複あり

実施の形態 4 では、テストシーケンス 1 (504)とテ ストシーケンス2(505)が、セル12を通過しない ので次のエラーメッセージが表示される。

12:テスト項目に重複あり

【0034】なお、実施の形態2~実施の形態4は、ど 30 うのように組み合わて用いてもよい。

【0035】実施の形態6.図13は、本発明の実施の 形態6によるテスト支援装置の機能構成図を示す。図1 3において、101は図1に示す状態遷移表101と同 様のものである。701は、状態遷移表101を入力 し、状態遷移表101内に含まれるイベントと状態を抽 出するイベント状態抽出部であり、702は、抽出され たイベントと状態を入力しイベント状態定義表703の 雛型を生成するイベント状態定義生成部である。704 は生成したイベント状態定義を編集するためのイベント 状態定義エディタである。

【0036】イベント状態定義表703は、論理名、I D、イベント状態種別、定義の4つの項目をもつ表であ る。従来、テストシーケンスを入力し、プログラムを自 動的にテストするテスト自動実行システムでは、このイ ベント状態定義表703を入力して、プログラム中の実 アドレスと、テストシーケンス中のイベントと状態との 対応を取っている。定義は、マクロ識別子を用いた算術 (不) 等式の論理演算で表現される。定義例を以下に示 す。

作成する。

\_\_10にプログラムが到達したときと定義する。

初期化, 1, EVENT, !M\_10

例2) イベント「値変更」は、変数マクロ名 I N P の内容が書かれるときに、バイト長比較で、O H 以上 5 H 以下になったときである。

値変更, 2, EVENT, 0H≦ (INP, BYTE) ≤5H

例3) 状態「変更中」は、変数マクロ名 I N P の 2 ビット目がオンのときである。

変更中、3、STATE、(INP、BIT、2)=1【0037】次に本実施の形態の動作について説明する。図14は、本実施の形態の動作を示すフローチャートである。まず、イベント状態抽出部701が状態遷移表101を入力し、同表内のすべてのイベントと状態を抽出する(901)。次にイベント状態定義生成部702が、シーケンス番号に1を代入し、抽出された各イベントと状態を対象として、イベントID付加処理(902)を繰り返した後、イベント状態定義表703への出力(907)を行なう。ID付加処理(902)においては、シーケンス番号をイベントと状態に付加して(903)、シーケンス番号を1つインクリメントする(905)。

【0038】図15は、本実施の形態の動作を説明する例である。図15において、801は入力となる状態遷移表であり、802は出力となるイベント状態定義表の雛型である。状態遷移表801において、イベントと状態は、e1, e2, s1, s2であり、802にはその論理名、1D、イベント状態種別が出力される。定義についてはUNDEFと出力している。図16は、図15に示したイベント状態定義表の雛型802を入力した直後のイベント状態定義エディタ704の画面例である。このイベント状態定義エディタ704を用いて操作者は、各イベントと状態の定義を入力することができる。

【0039】以上のように本実施の形態によれば、状態 遷移表に基づくテスト自動実行システムへの入力データ としてイベント状態定義を作成する場合において、仕様 である状態遷移表内のイベントと状態を用いて定義され たテストシーケンスに対して、操作者が過不足なくイベントと状態の定義を与えることを強要するので、誤りが 混入し難いという利点がある。

【0040】実施の形態7.図17は、本発明の実施の形態7によるテスト支援装置の機能構成図を示す。図17において、101、701、703は図13に示すものと同様のものである。1001は、イベント状態抽出部701からの出力と、イベント状態定義ファイル705からの出力を照合するイベント状態照合部である。1002はイベント状態照合部1001の出力結果を示すエラーリポートである。

【0041】次に本実施の形態の動作について説明する。図18は、本実施の形態の動作を示すフローチャー

トである。まず、イベント状態抽出部701が状態遷移表101を入力し、同表内のすべてのイベントと状態を抽出する(901)。その後、イベント状態照合部1001が、状態遷移表101より抽出したイベントととして照合処理(1201)を行ない、全イベント状態定義列に対してイベント状態のカ(1212)を行ない、エラーメッセージのカ(1212)を行ない、終了する。照合処理(1201)においては、全イベント状態定義列について個別照合処理(1202)を行なう。個別照合処理(1202)においては、状態遷移表101から抽出したイベント状態が、イベント状態定義ファイル705にあれば(1203)、そのイベント状態定義ファイル705の列にマークし(1204)、次の照合処理(1201)を行なう。そうでなければ再度個別総合処理を行なう。

12

20 イベント状態定義: ID:イベント状態の定義がない さらに、イベント状態チェックについてのイベント状態 定義チェック (1208) において、対象イベント状態 定義列にマークがないかどうかをチェックする。マーク がない場合、エラーメッセージの作成2 (1210) に おいて次のエラーメッセージを作成する。

すべてのイベント状態定義列についてチェックを行なっ

た結果一致するものがない場合には、エラーメッセージ

の作成1(1206)において次のエラーメッセージを

イベント状態の定義: ID: 遷移表にイベント状態の定 義がない

エラーメッセージの出力(1212)においては、エラーメッセージの作成1(1206)とエラーメッセージ 30 の作成2(1210)で作られたエラーメッセージをエ ラーレポート(1002)として出力する。

【0042】以上のように本実施の形態によれば、状態 選移表に基づくテストシーケンス作成において、仕様で ある状態遷移表内で使われるイベントと状態と、イベント状態定義表で定義されたイベントと状態の過不足を調べることができるので、テスト自動実行システムへの入力であるテストシーケンスを解釈する上で必要なイベント状態定義を誤りなく定義することができ、スムーズに テスト自動実行を行なうことが可能となる。

40 【0043】実施の形態8.図19は、本発明の実施の形態8によるテスト支援装置の機能構成図を示す。図19において、101、704、705は図13に示すものと同様のものである。1301は、イベント状態曲部701からの出力と、イベント状態定義ファイル705からの出力を照合するイベント状態照合部である。1302はイベント状態照合部1301の出力結果を示すエラーリポートである。1303はイベント状態照合部1301の出力であるイベント状態名を基にイベント状態定義ファイル705に新たなイベント状態定義の難型を追加するイベント状態定義生成部である。

【0044】次に本実施の形態の動作について説明する。図20は、本実施の形態の動作を示すフローチャートである。図20において、(901)は図14のフローチャートに示されるものと同じ処理を行なう。イベント状態照合部1301が行なう照合処理(1201)においては、図17のイベント照合部1001おける図18の照合処理(1201)に、(1301)の新イベント状態定義生成の処理が加わった以外は同じである。

(1301)では、イベント状態定義列の中で、遷移表内に存在しないものは、新イベント状態定義として、イベント状態定義生成部1303へ出力される。さらに、(1209)~(1212)は図18のものと全く同じである、(1302)では、シーケンス番号にイベント状態定義表内のID番号の最大値に1を足した数字を代入し、ID付加処理(902)とイベント状態定義表への出力(907)を行なう。(902)(907)は図14に示すものと全く同じ処理である。

【0045】以上のように本実施の形態によれば、状態 選移表に基づくテストシーケンス作成において、イベント状態定義表と仕様である状態遷移表とを比較し、イベ 20ント状態定義として足りないものは新たに定義を促したり、余計なイベント状態定義を検出したりすることができるので、仕様の変更が頻繁に起こる場合、すでに作られているテストシーケンスとそこで使われるイベント状態定義と仕様との整合性を保つことが容易となる。

#### [0046]

【発明の効果】第1の発明によれば、次に遷移する状態及び遷移時に実行される動作を含むテスト仕様と当該セルの通過回数とが記録される内部状態遷移表を表示する遷移表表示部と、この表示された内部状態遷移表中のセルが操作者により選択される操作を解釈し、この選択されたセルの通過回数を更新するとともに、選択されたセルに記述されている前記テスト仕様を出力するテストシーケンス生成部とを備えたことにより、現在状態に対するテスト項目の候補セルを見せ操作者を順次入力導いていくため、テスト項目のもれや誤りのないテストシーケンスを作ることができる。

【0047】第2の発明によれば、システムにより予め定義された前記テスト仕様が記述されているテストシーケンスファイルと、このテストシーケンスファイルに記述された前記テスト仕様と前記テストシーケンス生成部により出力された前記テスト仕様とを比較するテストシーケンスの誤りを検出することができる。さらに、仕様自体への変更に対し、既に存在するテストシーケンスが新しい仕様に適合しているかどうかをチェックすることができるので、仕様の変更にともなうテストシーケンスの再作成を効率良く行なうことができる。

【0048】第3の発明によれば、システムにより予め 50 チャートである。

14

定義された前記テスト仕様が記述されているテストシーケンスファイルと、このテストシーケンスファイル中の前記テスト仕様に該当する項目が前記テストシーケンス生成部により更新された前記内部状態遷移表中に存在するか否かをマークするマーキング部と、このマーキング部によりマークされた前記内部状態遷移表を解析し、テスト項目の重複を判定する重複判定部とを備えたことにより、ユーザがマニュアルで作成したテストシーケンスの冗長な部分を見つけることができる。

【0049】第4の発明によれば、システムにより予め 定義された前記テスト仕様が記述されているテストシーケンスファイルと、このテストシーケンスファイル中の 前記テスト仕様に該当する項目が前記テストシーケンス 生成部により更新された前記内部状態遷移表中に存在するか否かをマークするマーキング部と、このマーキング部によりマークされた前記内部状態遷移表を解析し、テスト項目の不足を判定する不足判定部とを備えたことにより、ユーザがマニュアルで作成したテストシーケンスの不足する部分を見つけることができる。

【0050】第5の発明によれば、次に遷移する状態とこの状態遷移を引き起こすイベントとが含まれる状態遷移表と、この状態遷移表中に含まれる前記状態と前記イベントとを抽出するイベント状態抽出部と、この抽出された状態とイベントとに基づいて、イベントの内容を定義したイベント状態定義表を生成するイベント状態定義生成部とを備えたことにより、操作者が過不足なくイベントと状態の定義を与えることができる。

【0051】第6の発明によれば、状態遷移を引き起こすイベントの内容がシステムにより予め定義されたイベント状態定義ファイルと、前記イベント状態抽出部により抽出されたイベントが前記イベント状態定義ファイル中に存在するか否かをチェックするイベント状態照合部とを備えたことにより、テスト自動実行システムへの入力であるテストシーケンスを解釈する上で必要なイベント状態定義を誤りなく定義することができる。

【0052】第7の発明によれば、前記イベント状態照合部のチェックにより、前記イベント状態抽出部により抽出されたイベントが前記イベント状態定義ファイル中に存在しなかった場合に、前記抽出されたイベントの内容を前記イベント状態定義ファイルに追加するイベント状態定義追加部を備えたことにより、仕様の変更が頻繁に起こる場合、すでに作られているテストシーケンスとそこで使われるイベント状態定義と仕様との整合性を保っことが容易となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施の形態1におけるテスト支援 装置の機能構成図である。

【図2】 状態遷移表の一例を示す図である。

【図3】 この発明の実施の形態1の動作を示すフロー チャートである。

【図4】 この発明の実施の形態1におけるテストシー ケンス生成支援の具体的イメージを示す一例である。

この発明の実施の形態2におけるテスト支援 装置の機能構成図である。

この発明の実施の形態2の動作を示すフロー 【図6】 チャートである。

この発明の実施の形態3におけるテスト支援 【図7】 装置の機能構成図である。

[図8] この発明の実施の形態3におけるマーキング 付きテストシーケンストレース部の動作を示すフローチ 10 ーチャートである。 ャートである。

【図9】 この発明の実施の形態3の動作を示すフロー チャートである。

【図10】 この発明の実施の形態4におけるテスト支 援装置の機能構成図である。

【図11】 この発明の実施の形態4の動作を示すフロ ーチャートである。

【図12】 この発明の実施の形態5におけるテストシ ーケンス評価の一例を示す図である。

援装置の機能構成図である。

【図14】 この発明の実施の形態6の動作を示すフロ ーチャートである。

【図15】 この発明の実施の形態6の入出力例を示し た図である。

16 【図16】 この発明の実施の形態6におけるイベント 状態定義エディタの画面例である。

【図17】 この発明の実施の形態7におけるテスト支 援装置の機能構成図である。

【図18】 この発明の実施の形態7の動作を示すフロ ーチャートである。

【図19】 この発明の実施の形態8におけるテスト支 援装置の機能構成図である。

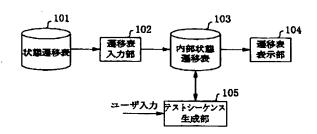
【図20】 この発明の実施の形態8の動作を示すフロ

【図21】 この発明による従来のテストケース生成装 置の機能構成である。

#### 【符号の説明】

101 状態遷移表、102 状態遷移表入力部、10 3 内部状態遷移表、104 遷移表表示部、105 テストシーケンス生成部、401 エラー判定付テスト シーケンストレース部、403 テストシーケンスファ イル、701イベント状態抽出部、702 イベント状 態定義生成部、703 イベント状態定義表、704 【図13】 この発明の実施の形態6におけるテスト支 20 イベント状態定義エディタ、705 イベント状態定義 ファイル、1001 イベント状態照合部、1002 エラーリポート、1301 イベント状態照合部、13 02 エラーリポート、1303 イベント状態定義生 成部、1701 マーキング付テストシーケンストレー ス部、1702 重複判定部、1802 不足判定部。

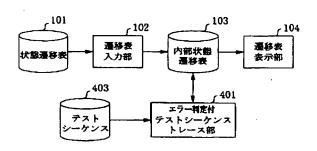
【図1】



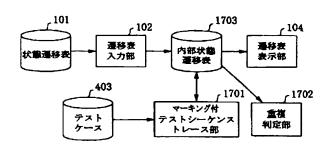
【図2】

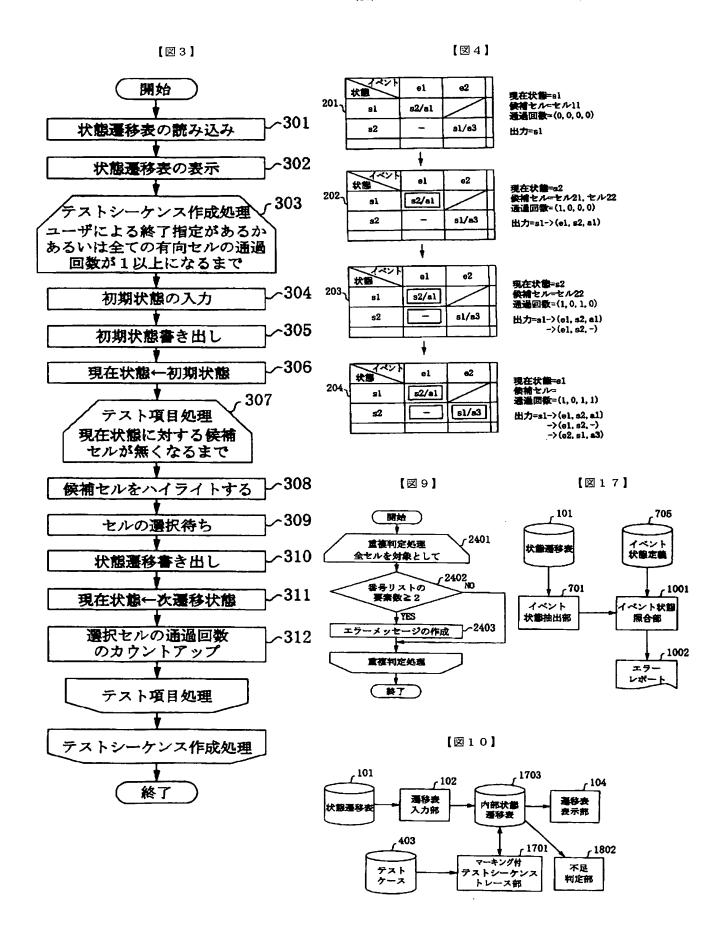
イベント 状態	el	e2	
BJ	s2/s1		
s2	_	sl/a3	

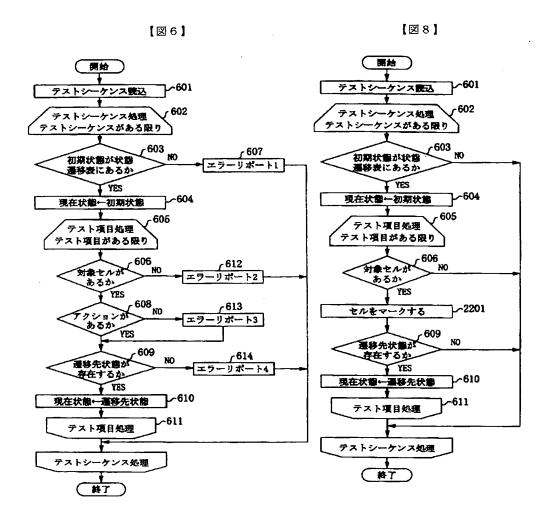
【図5】

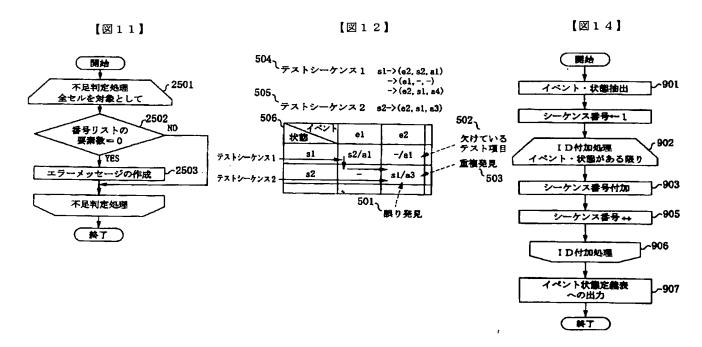


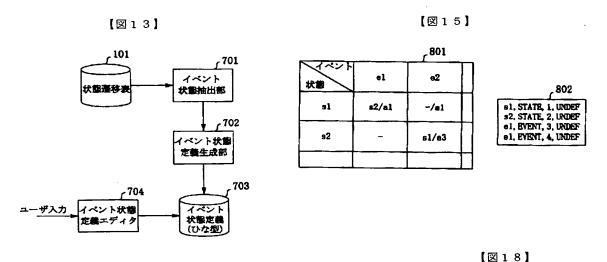
【図7】



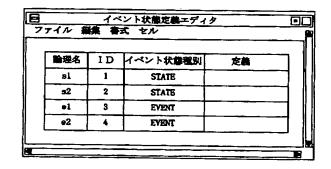




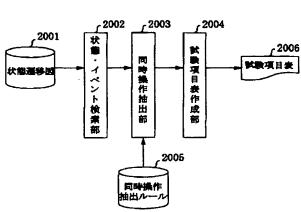


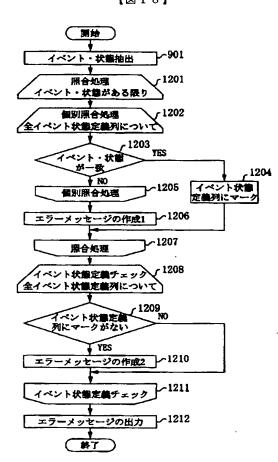


【図16】

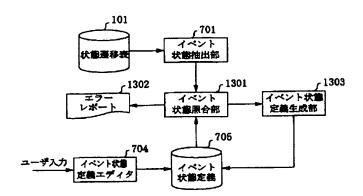


【図21】



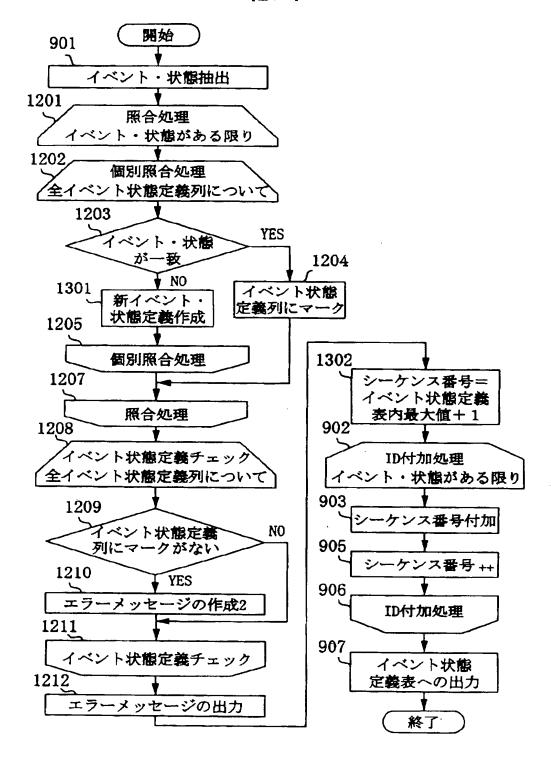


【図19】



£2.

【図20】



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.